

果てなき高度へ 羽ばたく技術セミナー

日時 10月28日(水)
時間 10:00～16:25
場所 東京ビッグサイト会議棟101

主催 日本精密測定機器工業会

受講料 **無料** 会員はテキスト代無料
※会員以外はテキスト代をご負担ください

申込方法
日本精密測定機器工業会HPから条項申込をダウンロードして頂き
必要事項をご記入後、事務局までメールでお申込みください。
<https://www.jpma.gr.jp/information/>



お問い合わせ先
日本精密測定機器工業会「セミナー」事務局
〒105-0003 東京都港区西新橋3-14-2
TEL. 03-3434-9557 FAX. 03-3434-1695 E-mail. info@jpma.gr.jp
※セミナーはハイブリッド開催
※講演概要は当工業会ホームページにてご参照ください

プログラム

受講
無料

10:05 - 11:00	精密計測の智能化と機上・インプロセス計測の動向 大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 高谷 裕浩 氏
11:05 - 12:00	ISO/TS 15530-2に基づいた座標測定機の測定不確かさ算出 産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 研究グループ長 佐藤 理 氏
12:00 - 13:00	昼食休憩
13:00 - 13:55	産業用ロボットの計測応用の規格化とフィジカルAI実装へのロードマップ リンクウィズ株式会社 吹野 豪 氏
14:00 - 14:30	ISO3611/JISB7502マイクロメータの解説 株式会社ミットヨ 品質保証部 標準管理課 齋藤 修 氏
14:30 - 14:45	休憩
14:45 - 15:10	レーザー式3Dスキャナー測定における測定物の色の影響について 地方独立行政法人山口県産業技術センター 技術支援部 製品技術グループ 専門研究員 近藤 拓郎 氏
15:10 - 15:35	「3次元デジタイザを用いた技術支援」～茨城県産業技術イノベーションセンターにおける活用事例～ 茨城県産業技術イノベーションセンター イノベーション戦略部 新ビジネス支援グループ 岡田 真 氏
15:35 - 16:00	表面粗さ輪郭形状測定機による微細形状評価時のスタイラス形状及び動作が測定結果に及ぼす影響 山梨県産業技術センター 富士技術支援センター 機械電子技術部 主任研究員 寺澤 章裕 氏
16:00 - 16:25	画像測定における幅測定と照明光量設定 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量標準調査室 室長 鍛島 麻理子 氏